



ФАНО РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05/16-14

Очная, заочная форма обучения

(подчеркнуть)

2016/2017 учебного года

Форма контроля – зачет, экзамен (подчеркнуть)

Дисциплина **Методы радиационных исследований изделий электронной техники**

Направление подготовки **09.06.01 Информатика и вычислительная техника**

(направленность: 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления)

Курс: 1 группа: 1 Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану 108 ч.

Ф.И.О. преподавателей: к.т.н., доцент, заместитель директора ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по наноэлектронике М.С. Горбунов

Дата проведения зачета, экзамена 17 июля 2017 г.

№ п/п	Ф.И.О. аспирантов	№ зачетной книжки	Отметка о сдаче зачета	Экзаменационная оценка		Подпись экзаменатора
				цифрой	прописью	
1	2	3	4	6	7	8
1	Дубровин Алексей Александрович	16-2	зачет			
2	Прозорова Александра Геннадьевна	16-4	зачет			
3				7		
4						
5						
6						

Число аспирантов на экзамене (зачете) 2

Из них получивших «отлично» -

получивших «хорошо» -

получивших «удовлетворительно» -

получивших «неудовлетворительно» -

Число аспирантов, не явившихся на экзамен (зачет) -

Число аспирантов, не допущенных к экзамену (зачету) -

Зав. аспирантурой /Табакова Л.Н./

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Принимать экзамены от аспирантов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость.
2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев, специально разрешенных директором.

